#### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. September 2004 (10.09.2004)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/077044 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G01N 27/74, 33/543
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/000149
- (22) Internationales Anmeldedatum:

30. Januar 2004 (30.01.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 09 132.7

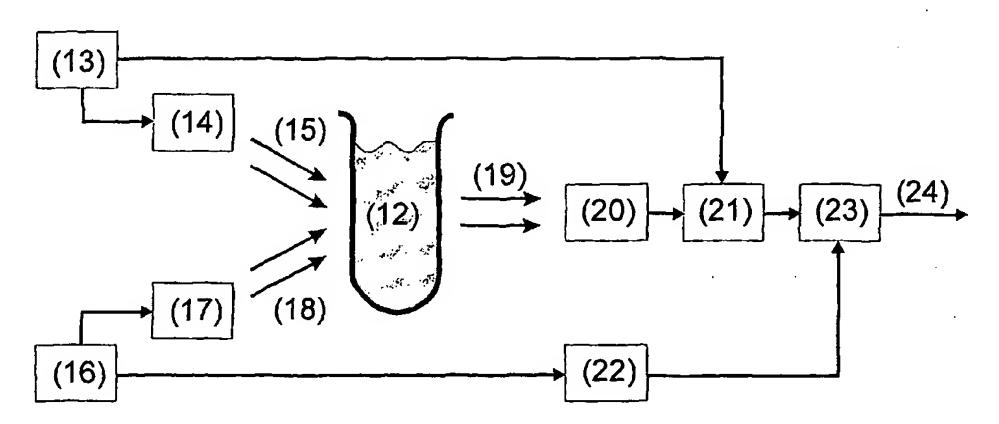
28. Februar 2003 (28.02.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH [DE/DE]; Wilhelm-Johnen-Strasse, 52425 Jülich (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MIETHE, Peter [DE/DE]; Dorfstrasse 42, 06632 Schleberoda (DE). KRAUSE, Hans-Joachim [DE/DE]; Pablo-Picasso-Strasse 30, 52499 Bacsweiler (DE). ZHANG, Yi [DE/DE]; Nordstrasse 36, 52428 Jülich (DE). WOLTERS, Norbert [NL/DE]; Katharinenstrasse 8, 52134 Herzogenrath (DE). PLAKSIN, Dmitry [RU/DE]; Prinzengracht 11, 52428 Jülich (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH; Fachbereich Patente, 52425 Jülich (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD AND DEVICE FOR SELECTIVELY DETECTING FERROMAGNETIC OR SUPERPARAMAGNETIC PARTICLES
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SELEKTIVEN NACHWEIS FERROMAGNETISCHER ODER SUPERPARAMAGNETISCHER PARTIKEL



(57) Abstract: The invention relates to a method for selectively detecting and/or quantifying superparamagnetic and/or ferromagnetic particles on analytes. The method is characterized in that a frequency component of magnetic fields (15, 18), which is generated due to the non-linearity of the magnetization characteristic curve of the particles, is measured at a mixing frequency. A device for selectively detecting and/or quantifying superparamagnetic and/or ferromagnetic particles on analytes comprises: a container (12) that contains particles, which are to be detected and/or quantified, on analytes; at least one oscillator (13, 16; 25) for generating frequencies of alternating magnetic fields (15, 18); at least one field generator (14, 17) for subjecting the analytes to alternating magnetic fields (15, 18); a magnetic field sensor (20) for measuring a response magnetic field (19) of the particles, and; at least one phase-sensitive detector (21, 23). These elements are configured in such a manner as to enable a frequency component of the magnetic fields (15, 18), which is generated due to the non-linearity of the magnetization characteristic curve of the particles, to be measured at a mixing frequency.

'O 2004/077044 △

KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Ein Verfahren zum selektiven Nachweis und/oder zur Quantifizierung superparamagnetischer und/oder ferromagnetischer Partikel an Analyten. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass eine aufgrund der Nichtlinearität der Magnetisierungskennlinie der Partikel erzeugte Frequenz-Komponente von Magnetfeldern (15, 18) bei einer Mischfrequenz gemessen wird. Eine Vorrichtung zum selektiven Nachweis und/oder zur Quantifizierung superparamagnetischer und/oder ferromagnetischer Partikel an Analyten umfasst: einen Behälter (12) mit nachzuweisendem und/oder zu quantifizierenden Partikeln am Analyten, mindestens einen Oszillator (13, 16; 25), zur Erzeugung von Frequenzen von Wechsel-Magnetfeldern (15, 18), mindestens einen Feldgenerator (14, 17) zur Beaufschlagung des Analyten mit Wechsel-Magnetfeldern (15, 18), einen Magnetfeldsensor (20), zur Messung eines Antwort-Magnetfeldes (19) der Partikel, mindestens einen phasenempfindlichen Detektor (21, 23), wobei die Bauteile so konfiguriert sind, dass eine aufgrund der Nichtlinearität der Magnetisierungskennlinie der Partikel erzeugte Frequenz-Komponente der Magnetfelder (15, 18) bei einer Mischfrequenz gemessen wird.

1

#### Beschreibung

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SELEKTIVEN NACHWEIS FERROMAGNETISCHER ODER SUPERPARAMAGNETISCHER PARTIKEL

Die Erfindung betrifft den Nachweis magnetischer Partikel als Marker an Analyten.

Aus dem Stand der Technik sind Nachweisverfahren von Analyten mittels Fluorochromen, Enzymen oder radioaktiver Teilchen als sogenannte Marker für Analyten bekannt. Nachteilig ist der lineare Detektionsbereich von Fluoreszenzmarkern bzw. die Empfindlichkeit enzymatischer Techniken begrenzt. Radioaktive Marker sind aufgrund der Strahlenschutzanforderungen problematisch.

10

15

20

25

Bioassays auf der Basis magnetischer Markierung des Analyten sind hierzu eine Alternative. Die magnetischen Partikel bestehen aus einem Eisenoxid-Kern mit definierten Durchmessern von einigen zehn bis einigen hundert Nanometern. Sie weisen eine biokompatible Oberflächenbeschichtung auf, mit der sie an den Analyten, z. B. an chemische Substanzen, oder an die Oberfläche von Zellen oder Viren in an sich bekannter Weise gebunden werden.

Vorteilhaft sind derartige Marker stabil, ungiftig und mittels magnetischer Felder manipulierbar. Partikel aus Eisenoxid sind superparamagnetisch. Das Vorhandensein magnetischer Partikel in einem Probenvolumen kann durch Wechselfeld-Suszeptometrie bestimmt werden. Im Falle der Monodispersität, d.h. einheitlicher Partikelgröße,

2

kann die Konzentration der Partikel auch quantitativ bestimmt werden.

5

10

15

20

25

Aus US 6,110,660 ist der Nachweis magnetischer Partikel mittels Suszeptometrie bekannt. Dabei wird die magnetische Suszeptibilität eines Analyten mittels einer Maxwell-Brücke im Frequenzbereich um 200 kHz gemessen. Die gemessene elektrische Spannung an einem Ausgangsverstärker der Brücke ist der Suszeptibilität der Lösung proportional. Bei konstanter Partikelgröße ist wiederum die Suszeptibilität proportional zur Anzahl der magnetischen Partikel in Lösung.

Nachteilig ist dieses Verfahren nicht selektiv. Zwar ist die magnetische Suszeptibilität konzentrierter Nanopartikel-Lösungen hoch. Allerdings erfordern Immunoassay-Verfahren in der Regel den Nachweis sehr geringer Konzentrationen von Biomolekülen und dementsprechend sehr geringe Konzentrationen magnetischer Marker-Partikel. Die resultierende Suszeptibilität der Lösung ist dann sehr klein und kaum von der Suszeptibilität einer Vergleichslösung ohne magnetische Partikel zu unterscheiden. Die Erhöhung der Verstärkung am Ausgang der Maxwell-Brücke ist keine brauchbare Lösung dieses Problems, weil parasitäre Effekte wie Suszeptibilitätsvariationen der Probengefäße, der Reagenzien und der Laborumgebung ebenso zu Streuungen in der Ausgangsspannung führen wie thermische Effekte und elektronisches Driften der Bauteile der Ausleseschaltung.

Aus US 6,046,585 ist die Bewegung von Magnetpartikel-Proben zur Erzielung einer niederfrequenten Modulation

20

25

des Messsignals unter Verwendung eines gradiometrischen SQUID-Magnetfelddetektors bekannt. Nachteilig werden etwaige Signale der Probenhalterung und der Probengefäße mit diesem Verfahren nicht unterdrückt.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum selektiven Nachweis superpara- und/oder ferromagnetischer Partikel bereit zu stellen, welches mit geringem apparativen Aufwand hochsensitiv solche Partikel nachzuweisen vermag. Aufgabe der Erfindung ist es weiter eine diesbezügliche Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens bereit zu stellen.

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß Hauptanspruch und durch eine Vorrichtung gemäß Nebenanspruch
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus
den darauf jeweils rückbezogenen Patentansprüchen.

Zum selektiven Nachweis und/oder zur Quantifizierung superparamagnetischer und/oder ferromagnetischer Partikel wird eine aufgrund der Nichtlinearität der Magnetisierungskennlinie der Partikel erzeugte Frequenz-Komponente von Magnetfeldern bei einer Mischfrequenz gemessen.

Superpara- und ferromagnetische Stoffe weisen eine nichtlineare Magnetisierungskennlinie auf, eine Eigenschaft, welche erfindungsgemäß zum selektiven Nachweis dieser Stoffe genutzt wird. Das Verfahren nutzt die Abhängigkeit der differentiellen Suszeptibilität, (das heißt die Ableitung der magnetischen Suszeptibilität

**WO** 2004/077044

5

10

15

4

nach dem Magnetfeld) der Partikel von dem auf die Partikel einwirkenden Magnetfeld, aus.

Die Partikel werden mit einem ersten Wechsel-Magnetfeld beaufschlagt. Dies hat eine Aussteuerung der Magnetisierungskennlinie der Partikel zur Folge (Aussteuer-Magnetfeld).

Bevorzugt weist das Aussteuer-Magnetfeld eine Frequenz zwischen 50 und 100 Hertz auf. Durch Auswahl solcher niederfrequenter Wechsel-Magnetfelder können niedrige Ströme und Spannungen verwendet werden.

Die Partikel werden zudem mit einem zweiten WechselMagnetfeld mit einer zum Aussteuer-Magnetfeld verschiedenen Frequenz beaufschlagt. Das zweite WechselMagnetfeld dient der Abtastung der Nichtlinearität der
Magnetisierungskennlinie der Partikel (AbtastMagnetfeld).

Als Folge tritt ein auf Grund der Einwirkung der beiden Wechsel-Magnetfelder induziertes Antwort-Magnetfeld der magnetischen Partikel auf, welches gemessen wird.

Das Abtast-Magnetfeld kann vorteilhaft eine Frequenz zwischen 10 und 100 Kilohertz aufweisen. Dadurch wird im Falle der Verwendung einer Induktionsspule als Magnetfeldsensor vorteilhaft bewirkt, dass die in dieser Spule durch das Antwort-Magnetfeld induzierte Spannung, die der Frequenz des Antwort-Magnetfeldes proportional ist, hoch und damit leichter messbar ist.

5

Die auftretende Amplitudenvariation des AntwortMagnetfeldes ist primär abhängig von der Art und der
Konzentration der magnetischen Partikel. Superpara- und
ferromagnetische Stoffe weisen - wie erwähnt- eine
nicht-lineare Magnetisierungskennlinie auf. Auf Grund
der nicht-linearen Magnetisierungskennlinie lassen sich
die genannten Stoffe selektiv nachweisen.

5

10

15

20 -

25

Das Antwort-Magnetfeld weist an einem Sensor Frequenz-Mischkomponenten der beiden auf die magnetischen Partikel beaufschlagten Wechsel-Magnetfelder auf. Eine solche Komponente kann durch geeignete phasenempfindliche Detektion (Demodulation) nachgewiesen werden. Die dadurch erzeugte Spannung entspricht dem Amplitudenverlauf der Komponente und wird als Ausgangssignal zur Bestimmung der Konzentration des Analyten herangezogen.

Besonders vorteilhaft wird der zeitliche Verlauf der Amplitude (Amplitudenvariation) des AntwortMagnetfeldes durch phasenempfindliche Detektion bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes gemessen. Im Falle superpara- und ferromagnetischer Analyten weist der zeitliche Verlauf der Amplitude des Antwort-Magnetfeldes Frequenzkomponenten auf, die Vielfache der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes sind. Besonders ausgeprägt sind geradzahlige Vielfache, und dabei insbesondere die Komponente mit der doppelten Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes.

Der Grund dafür ist, dass das Aussteuer-Magnetfeld zu einer verzerrten magnetischen Induktion der magnetischen Partikel führt. Das zusätzlich aufgebrachte Ab-

6

tast-Magnetfeld hat in dem Falle, dass die durch das Aussteuer-Magnetfeld vorliegende momentane magnetische Induktion gerade einen Nulldurchgang durchläuft, eine große zusätzliche magnetische Induktion zur Folge. In dem Falle, dass die Aussteuer-Induktion gerade ein Betragsmaximum aufweist, führt das Abtast-Magnetfeld hingegen nur zu einer kleinen, zusätzlichen Induktion. Die Amplitude wird nämlich durch die Ableitung der Magnetisierungskurve der magnetischen Partikel kontrolliert, die im Falle großer Magnetfelder aufgrund des Sättigungseffektes geringer ist als im Falle kleiner Magnetfelder.

5

10

15

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf der Amplitude des Antwort-Magnetfeldes bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes als Funktion der Zeit, so variiert diese Amplitude gerade mit der doppelten Frequenz der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes. Sie hat ihre Minima bei den Extrema der Aussteuerung und ihre Maxima bei den Nulldurchgängen.

Die Amplitudenvariation des Antwort-Magnetfeldes wird zweckmäßig durch phasenempfindliche Detektion demoduliert. Das Antwort-Magnetfeld wird zweckmäßig durch einen Magnetfeldsensor in eine elektrische Spannung gewandelt und gegebenenfalls verstärkt.

Die resultierende Ausgangsspannung ist im Falle monodisperser Partikel vorteilhaft linear proportional der Konzentration des Analyten, welche nach Kalibration des Messsystems entsprechend berechnet wird.

7

Eine Vorrichtung zum selektiven Nachweis und/oder zur Quantifizierung superparamagnetischer und/oder ferromagnetischer Partikel mittels Messung der differentiellen Suszeptibilität der Partikel, umfasst einen Behälter mit den nachzuweisendem und/oder zu quantifizierenden Partikeln am Analyten. Der Behälter kann aus einem für das Verfahren geeignetem, nicht magnetischen Material, das heißt z. B. aus Glas oder Kunststoff, bestehen.

5

15

20

25

Die Vorrichtung umfasst mindestens einen Oszillator.

Der Oszillator ist geeignet, um Frequenzen von WechselMagnetfeldern, wie im vorliegenden Fall nötig, zu erzeugen.

Besonders vorteilhaft umfasst die Vorrichtung einen Basisfrequenz-Oszillator, aus dem die Frequenzen des Abtast- und des Aussteuer-Magnetfeldes mittels Frequenz-teilern phasenstarr abgeleitet werden.

Es können aber auch zwei Oszillatoren zur unabhängigen Erzeugung beider Wechsel-Magnetfelder verwendet werden. Ein erster Oszillator erzeugt dann die Frequenz des Abtast-Magnetfeldes, ein zweiter Oszillator die Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes.

Die Vorrichtung weist zudem mindestens einen Feldgenerator auf. Dieser dient zur Beaufschlagung des Analyten mit den Wechsel-Magnetfeldern. Es können besonders vorteilhaft zwei solcher Feldgeneratoren vorliegen, die den Analyten mit dem ersten bzw. zweiten Wechsel-

10

Magnetfeld, also dem Aussteuer-Magnetfeld und dem Abtast-Magnetfeld, beaufschlagen.

Die Vorrichtung umfasst einen Magnetfeldsensor, der der Aufnahme eines Antwort-Magnetfeldes der Partikel dient. Der Magnetfeldsensor wandelt und verstärkt die Amplitudenvariation des Antwort-Magnetfeldes der Partikel und leitet sie an einen phasenempfindlichen Detektor weiter.

Die Vorrichtung umfasst ferner mindestens einen phasenempfindlichen Detektor, der von einem Oszillator gegebenenfalls über einen Frequenzteiler mit einer Referenzfrequenz gespeist wird. Der phasenempfindliche Detektor ermittelt die Amplitude des Antwort-Magnetfeldes bei dieser Frequenz.

15 Die Vorrichtung kann mindestens einen zweiten phasenempfindlichen Detektor umfassen, der ebenfalls von einem Oszillator gegebenenfalls über einen Frequenzteiler mit einer Referenzfrequenz gespeist wird. In diesem Falle würde der erste phasenempfindliche De-20 tektor zweckmäßigerweise mit der Abtastfrequenz als Referenz gespeist und dementsprechend die Amplitude des Antwortmagnetfeldes bei der Abtastfrequenz liefern. Der zweite phasenempfindliche Detektor würde als Referenz mit einem Vielfachen der Frequenz des Aussteuer-Magnet-25 feldes gespeist. Der zweite phasenempfindliche Detektor untersucht die Amplitude des Antwort-Magnetfeldes, welche über den ersten phasenempfindlichen Detektor an den zweiten phasenempfindlichen Detektor geleitet wird, auf eine Frequenzkomponente, die einem geradzahligen Viel-

15

20

fachen, insbesondere dem Doppelten der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes entspricht. Der zweite phasenempfindliche Detektor erzeugt eine Ausgangsspannung, die der Amplitude dieser Frequenzkomponente entspricht.

Zur Maximierung der demodulierten Signale kann die Vorrichtung ferner Phasenschieber an den Referenzeingängen der phasenempfindlichen Detektoren beinhalten.

> Im weiteren wird die Erfindung an Hand von Ausführungsbeispielen und der beigefügten Figuren 1 bis 8 näher beschrieben.

Figur 1 veranschaulicht die zugrundeliegende physikalische Eigenschaft superparamagnetischer und ferromagnetischer Materialien. Derartige Materialien weisen eine nicht-lineare Magnetisierungskennlinie auf (Fig. 1b).

Im Gegensatz hierzu weisen diamagnetische und paramagnetische Materialien eine lineare Magnetisierungskennlinie auf (Fig. 1a).

Die Substanz werde mit einem Wechselfeld der Frequenz f und der Amplitude  $H_a$  beaufschlagt. Ein etwaiges zusätzlich vorhandenes statisches Magnetfeld, z. B. das Erdmagnetfeld, werde mit  $H_0$  bezeichnet.

$$H(t) = H_a \sin(2\pi f t) + H_0 \tag{1}$$

Figur 1a stellt die magnetische Aussteuer-Induktion 3 einer paramagnetischen Substanz auf ein Aussteuer
Magnetfeld 1 dar. Eine paramagnetische Substanz ist charakterisiert durch eine konstante Permeabilität

 $\mu = \mu_0 \mu_r$  mit  $\mu_r > 1$ . Dabei bezeichnet  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{V_S}{Am}$  die

Permeabilität des Vakuums und  $\mu_r$  die relative Permeabilität oder Permeabilitätszahl des Materials. Die resultierende magnetische Aussteuer-Induktion 3

5 
$$B(t) = \mu_0 \mu_r H_a \sin(2\pi f t) + \mu_0 \mu_r H_0$$
 (2)

ist, wie in Figur la gezeigt, unverändert sinusförmig. Ein paramagnetisches Material mit einer linearen Magnetisierungskennlinie 2 liefert also eine unverzerrte Antwort. Das gleiche gilt entsprechend für diamagnetische Materialien mit konstanter relativer Permeabilität  $\mu_r < 1$ .

Superparamagnetische Substanzen weisen die erwähnte nicht-lineare und nicht-hysteretische Magnetisierungskennlinie 5 auf. Die Magnetisierung M(H) superparamagnetischer Substanzen lässt sich im allgemeinen durch die Formel

$$M(H) = M_s L \left( \frac{\mu_0 H}{B_c} \right) \tag{3}$$

beschreiben. Dabei bezeichnet

$$L(x) = \coth(x) - \frac{1}{x} \tag{4}$$

**WO 2004/077044** 

die Langevin-Funktion,  $B_c$  die charakteristische Induktion,  $M_s$  die Sättigungsmagnetisierung der Partikel und  $x = \frac{\mu_0 H}{B_c}$  das Argument der Langevin-Funktion.

Die typische magnetische Antwort eines superparamagnetischen Materials ist durch die verzerrte Sinusfunktion
als magnetische Aussteuer-Induktion 6 in Fig. 1b dargestellt und lässt sich im allgemeinen durch Einsetzen
von Formel (1) in Formel (3) gemäß Formel (5) beschreiben:

10 
$$B(t) = M_s L \left( \frac{\mu_o}{B_c} \left[ H_a \sin(2\pi f t) + H_0 \right] \right)$$
 (5)

Erfindungsgemäß wird ein Aussteuer-Magnetfeld 4 zur Aussteuerung der Magnetisierungskennlinie 5 verwendet. Das Aussteuer-Magnetfeld 4 ist ein Wechsel-Magnetfeld mit bestimmter Frequenz f.

- Tusätzlich wird der Analyt mit einem zweiten Wechselfeld (nicht dargestellt), einem sogenannten AbtastMagnetfeld, beaufschlagt. Die Frequenz des AbtastMagnetfeldes wird verschieden von der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 4 gewählt.
- Figur 2 erläutert das dem Verfahren zugrunde liegende Prinzip. Figur 2b kennzeichnet den Fall eines superparamagnetischen oder ferromagnetischen Analyten und Fig. 2a den eines diamagnetischen oder paramagnetischen Analyten. Das Aussteuer-Magnetfeld 4 führt, wie in Fig. 1 gezeigt, zu einer verzerrten magnetischen Aussteuer-

10

15

20

Induktion 6, deren zeitliche Abhängigkeit durch Formel (5) beschrieben wird. Das zusätzlich aufgebrachte zweite Wechsel-Magnetfeld führt als Abtast-Magnetfeld in dem Falle, dass die durch das Aussteuer-Magnetfeld 4 erzeugte magnetische Aussteuer-Induktion 6 seinen Nulldurchgang durchläuft, zu einer großen zusätzlichen Abtast-Induktion bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes (Figur 2b, Nr. 9).

In dem Falle, dass die durch das erste Wechsel-Magnetfeld (Aussteuer-Magnetfeld 4) erzeugte Induktion 6 ein
Betragsmaximum aufweist, führt das Abtast-Magnetfeld
nur zu einer kleinen zusätzlichen Induktion (Figur 2b,
Nr. 10).

Die Amplitude des Antwort-Magnetfeldes 11 wird nämlich durch die Ableitung der Magnetisierungskennlinie kontrolliert. Im Falle superparamagnetischer oder ferromagnetischer Substanzen ist diese Steigung der Magnetisierungskennlinie im Falle großer Magnetfelder |H| erheblich kleiner als im Ursprung bei H=0. Für superparamagnetische Substanzen mit einer Magnetisierungskennlinie gemäß Gleichung (5) ergibt sich diese Aussage durch Betrachten der Ableitung der Langevin-Funktion,

$$\frac{dL(x)}{dx} = 1 - \coth(x)^2 - \frac{1}{x^2} \tag{6}$$

die für große |x| erheblich kleiner ist als im Ursprung bei x = 0.

Stellt man den Verlauf der Amplitude 11 der magnetischen Induktion, das heißt des Antwort-Magnetfeldes, bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes als Funktion der Zeit dar, so erkennt man, dass diese Amplitude 11 gerade mit der doppelten Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 4 variiert. Sie hat ihre Minima bei den Extrema und ihre Maxima bei den Nulldurchgängen des Aussteuer-Magnetfeldes 4 bzw. der magnetischen Aussteuer-Induktion 6.

5

25

30

Im Falle eines paramagnetischen Analyten erhält man aufgrund der linearen Magnetisierungskennlinie 2 in Figur 1 eine unverzerrte magnetische Induktion 3 durch das Aussteuer-Magnetfeld 1. Somit erhält man eine gleichbleibende Amplitude 8 der zusätzlichen Induktion 7 aufgrund des Abtast-Magnetfeldes unabhängig davon, welchen Wert das Aussteuer-Magnetfeld 1 bzw. die Aussteuer-Induktion 3 gerade annimmt (Figur 2a, Nr. 7). Die entsprechende Amplitude 8 der magnetischen Induktion bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes ist zeitlich konstant.

Neben der doppelten Frequenz der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 4 (bzw. Aussteuer-Induktion 6) enthält die Amplitude 11 des Aussteuer-Magnetfeldes 4 bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes auch höhere Harmonische der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 4. Bei einer symmetrischen Aussteuerung der Magnetisierungskennlinie 5 (d.h.  $H_0 = 0$ ) findet man allerdings nur Frequenzkomponenten bei geradzahligen Vielfachen der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 4. Bringt man zusätzlich ein statisches Gleichfeld  $H_0$  auf den Analyten

14

auf, so erhält man zusätzliche Frequenzkomponenten bei ungeradzahligen Vielfachen der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes.

Das Verfahren weist den Vorteil auf, daß nur Analyten mit nicht-linearer Magnetisierungskennlinie 5 eine 5 zeitliche Variation der Amplitude 11 zeigen, wie in Fig. 2b gezeigt. Paramagnetische oder diamagnetische Substanzen mit linearer Magnetisierungskennlinie 2 hingegen weisen eine konstante Amplitude 8 der magneti-10 schen Induktion bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes auf (Fig. 2a). Diese Selektivität zeichnet das erfindungsgemäße Verfahren gegenüber den Verfahren gemäß Stand der Technik aus, die nicht unterscheiden, ob die gemessene Suszeptibilität von einem dia- bzw. paramag-15 netischen oder einem super- bzw. ferroparamagnetischen Material herrührt.

Figur 3 zeigt eine erste Vorrichtung zum selektiven Nachweis und/oder zur Quantifizierung superparaund/oder ferromagnetischer Partikel an Analyten. Die Bauteile sind so konfiguriert, dass eine aufgrund der Nichtlinearität der Magnetisierungskennlinie 5 der Partikel erzeugte Frequenz-Komponente der Magnetfelder 15, 18 bei einer Mischfrequenz gemessen wird.

20 -

Erforderlich sind ein geeigneter Behälter 12, in dem sich ein Analyt in einem Meßvolumen befindet. Der Analyt kann durch an sich bekannte Verfahren wie selektive Physisorptionsreaktion, Chemisorptionsreaktion, Präzipitation, Filtration, oder Extraktion in den Behälter 12 eingebracht werden. An den Analyten sind nachzuwei-

**WO** 2004/077044

5

15

20

25

sende superpara- und/oder ferromagnetische Partikel gekoppelt.

Ein Oszillator 16 erzeugt die Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 18, welches mittels eines Feldgenerators 17 dem Analyten beaufschlagt wird.

Ein Oszillator 13 erzeugt die Frequenz eines zweiten Wechsel-Magnetfeldes, des Abtast-Magnetfeldes 15, welches mittels eines weiteren Feldgenerators 14 dem Analyten beaufschlagt wird.

Das von den Partikeln bzw. Analyten ausgehende Antwort-Magnetfeld 19 wird von einem Magnetfeldsensor 20 in eine elektrische Spannung gewandelt und vorverstärkt.

Ferner umfasst die Vorrichtung einen ersten phasenempfindlichen Detektor 21, der die Frequenz des Abtast-Magnetfeldes 15 vom Oszillator 13 als Referenz eingespeist bekommt. Dieser phasenempfindliche Detektor 21 ermittelt den zeitlichen Verlauf der Amplitude (s. Fig. 2, Nr. 11 bzw. 8) des Antwort-Magnetfeldes 19 bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes 15. Diese Amplitude 11 bzw. 8 wird durch einen zweiten phasenempfindlichen Detektor 23, der durch Oszillator 16 die Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 18 über einen m-fachen Frequenzvervielfacher 22 als Referenz gespeist bekommt, auf eine Frequenzkomponente untersucht, die dem m-fachen Vielfachen der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 18 entspricht, mit einer ganzen, positiven Zahl m. Bevorzugt wird m gerade gewählt, besonders bevorzugt ist m = 2. Die erzeugte Ausgangsspannung 24 entspricht der

Amplitude dieser Frequenzkomponente. Es wird eine Frequenz-Komponente bei einer Mischfrequenz gemessen, die nur bei Vorliegen einer Nichtlinearität der Magnetisierungskennlinie der Partikel auftritt.

Sofern die Detektionskette 19 bis 23 linear arbeitet, ist die Ausgangsspannung 24 linear vom superparamagnetischen/ferromagnetischen Moment im Probenvolumen von Behälter 12 abhängig.

Bei konstantem Moment der Einzel-Magnetpartikel im Ana-10 lyten und konstantem Messvolumen ist die Konzentration der magnetischen Marker in der Probe proportional zur Ausgangsspannung 24. Die Amplitude des Aussteuer-Magnetfeldes 18 wird in vorteilhafter Weise derart gewählt, dass der Analyt in die magnetische Sättigung ge-15 trieben wird. Im Falle superparamagnetischer Partikel, deren Magnetisierungskennlinie durch Gleichung (3) beschreibbar ist, wird die Amplitude des Aussteuer-Magnetfeldes 18 in der Größenordnung des charakteristischen Feldes Bc der verwendeten superparamagnetischen 20 Partikel gewählt. Die Krümmung der der Magnetisierungskennlinie (Gleichung 3) zugrundeliegenden Langevin-Funktion

$$\frac{d^2 L(x)}{dx^2} = -2 \coth(x) \cdot \left(1 - \coth(x)^2\right) - \frac{2}{x^3}$$
 (7)

hat ihr Betragsmaximum bei x=1,37. Besonders vorteilhaft ist also eine Amplitude des Aussteuer-Magnetfeldes
la von  $\mu_0 H_a = 1,37 B_c$ . Die Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 18 wird zur Aussteuerung der Magnetisierungs-

10

25

kennlinie 5 in vorteilhafter Weise niedrig gewählt,
z. B. zwischen 50 Hz und 100 Hz, denn zur Erzeugung von
Feldern derart niedriger Frequenzen können Spulen mit
hoher Windungszahl und dementsprechend niedrige Ströme
und Spannungen verwendet werden. Das Abtast-Magnetfeld
15 wird in vorteilhafter Weise hochfrequent gewählt,
z. B. zwischen 10 kHz und 100 kHz. Insbesondere bei der
Verwendung von Induktionsspulen als Magnetfeldsensoren
20 hat eine hohe Frequenz des zweiten Magnetfeldes den
Vorteil, dass die der Frequenz proportionale induzierte
Spannung 24 in der Messspule 20 hoch ist.

Ein etwaiges statisches Umgebungs-Gleichfeld wird in vorteilhafter Weise möglichst klein gewählt.

Figur 4 skizziert eine alternative Vorrichtung. Ein

Quarzoszillator 25 wird zur Erzeugung einer Frequenz
verwendet, die mittels dreier Frequenzteiler 26, 27 und
28 heruntergeteilt wird. Die Teilungsverhältnisse der
drei Teiler 26, 27 und 28 werden derart gewählt, dass
sie jeweils

$$\frac{1}{\ell}, \frac{1}{m \cdot n} \text{ und } \frac{1}{n}$$

mit ganzen, positiven Zahlen  $\ell$  und n betragen. Die ganze, positive Zahl m bezeichnet das Vielfache der Aussteuer-Frequenz, das demoduliert wird. In vorteilhafter Weise wird m gerade, in besonders vorteilhafter Weise wird m=2 gewählt. Die Feldgeneratoren 17 und 14 erzeugen das Aussteuer-Magnetfeld 18 und das Abtast-Magnetfeld 15. Das Antwort-Magnetfeld 19 wird über eine

**WO** 2004/077044

5

10

15

20

25

30

18

PCT/DE2004/000149

differentielle, das heißt gradiometrische Induktionsspule als Magnetfeldsensor 20 aufgenommen. Die Spule
ist derart angefertigt, dass sie aus zwei identisch gefertigten, aber jeweils gegensinnig gewickelten, in Serie geschalteten Teilspulen besteht, wobei der Analyt
im Behälter 12 nur in eine der beiden Teilspulen eingetaucht wird. Damit wird vorteilhaft erreicht, dass der
parasitäre Effekt der direkten Induktion einer elektrischen Spannung bei der Abtastfrequenz gering gehalten
wird, so dass die Amplitude des Abtast-Magnetfeldes 15
sehr hoch gewählt werden kann, ohne dass eine Übersteuerung des Vorverstärkers des Magnetfeldsensors 20 eintritt. Auf diese Weise wird eine Steigerung der Empfindlichkeit der Apparatur erreicht.

Ferner beinhaltet die Vorrichtung einen ersten phasenempfindlichen Detektor 21, der die Frequenz des Abtast-Magnetfeldes 15 vom Frequenz-Teiler 26 als Referenz eingespeist bekommt und der den zeitlichen Verlauf der Amplitude (s. Fig. 2, Nr. 11 bzw. Nr. 8) des Antwort-Magnetfeldes 19 bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes 15 ermittelt. Diese Amplitude 11 bzw. 8 wird durch einen zweiten phasenempfindlichen Detektor 23, auf eine Frequenzkomponente untersucht, die dem m-fachen Vielfachen der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes 18 entspricht, mit einer ganzen, positiven Zahl m. Diese Referenzfrequenz wird im Ausführungsbeispiel der Figur 4 von einem Frequenz-Teiler 28 direkt aus der Frequenz des Oszillators 25 heruntergeteilt, anstelle, wie im Beispiel der Figur 3, einen Frequenzvervielfacher einsetzen zu müssen. In vorteilhafter Weise sind auf diese Weise alle drei Frequenzen phasenstarr gekoppelt, so

WO 2004/077044

5

10

15

20

25

dass ein etwaiger Oszillatordrift unerheblich für die Messung ist.

Nach den beiden phasenempfindlichen Detektoren 21 und 23 steht die Ausgangsspannung 24 als Messsignal zur Verfügung.

Figur 5 skizziert eine weitere Vorrichtung. Ein Quarzoszillator 25 wurde als Frequenzbasis verwendet, die
mittels dreier Frequenzteiler 29, 30 und 28 heruntergeteilt wurde. Die Teilungsverhältnisse der drei Teiler
29, 30 und 28 werden derart gewählt, dass sie jeweils

$$\frac{1}{n+m}$$
,  $\frac{1}{n(n+m)}$  und  $\frac{1}{n}$ 

mit ganzen, positiven Zahlen m und n betragen. Dabei bezeichnet m wieder das Vielfache der Aussteuer-Frequenz. In vorteilhafter Weise wird m gerade, in besonders vorteilhafter Weise wird m = 2 gewählt. Die Vorrichtung aus Figur 5 beinhaltet nur einen phasenempfindlichen Detektor 21, der die n-fach heruntergeteilte Frequenz des Oszillators 25 als Referenz eingespeist bekommt. Dieser phasenempfindliche Detektor 21 ermittelt den zeitlichen Verlauf der gleichen Magnetfeldkomponente wie in den beiden vorher vorgestellten Ausführungsbeispielen aus Fig. 3 und 4.

Experimentell wurden Proben verschiedener Konzentrationen von Magnetpartikeln hergestellt und vermessen. Dazu wurde eine Lösung von kolloidalen Eisenoxid-Partikeln im Nanometer-Größenbereich hergestellt und seriell mit

isotonischer Kochsalzlösung (PBS) verdünnt. Figur 6 zeigt die gemessene Ausgangsspannung mit Standardabwei-chung als Funktion der Eisen-Konzentration der Proben.

Figur 7 zeigt, wie die Messsignale einer Probe fester

Konzentration in Abhängigkeit von einem statischen Umgebungs-Gleichfeld Ho variieren. Maximale Ausgangsspannung erhält man bei minimalem Gleichfeld. Bei einer Gleichfeldamplitude von etwa 1,9 mT beobachtet man ein Minimum der Ausgangsspannung, für höhere Gleichfelder steigt das Signal wieder an. Rechnerisch lässt sich zeigen, dass das Signal einen Verlauf wie die dritte Ableitung der Langevin-Funktion

$$\frac{d^3L(x)}{dx^3} = -2\left(1 - \coth(x)^2\right)^2 + 4\coth(x)^2 \cdot \left(1 - \coth(x)^2\right) + \frac{6}{x^4}$$
 (8)

haben sollte. In Figur 7 ist vergleichsweise diese Funktion mit skalierter Amplitude und angepasstem charakteristischen Feldwert  $B_c = 1.4$  mT  $(x = \mu_0 H/B_c)$  eingezeichnet. Die Übereinstimmung mit den Messwerten ist insbesondere für kleine statische Gleichfelder  $H_0$  beeindruckend gut.

Figur 8 stellt die gemessene Abhängigkeit der Ausgangsspannung einer Probe fester Konzentration in Abhängigkeit von der Amplitude des Aussteuer-Magnetfeldes dar.
Durch Integration über den amplitudenabhängigen Signalverlauf wurde das zu erwartende Signal berechnet und in
Fig. 8 eingetragen. Die Übereinstimmung mit den Messwerten ist insbesondere für kleine Amplituden gut.

21

Das erfindungsgemäße Verfahren/Vorrichtung kann insbesondere für folgende Anwendungen verwendet werden:

Nachweis von chemischen Substanzen, Zellen oder Viren über die quantitative Erfassung der molekularen Wechselwirkung, insbesondere die Ligand-Rezeptor-Wechselwirkung, die Antigen-Antikörper-Wechselwirkung und die Wechselwirkung zwischen Oligonucleotiden, wobei die superpara- und/oder ferromagnetischen Partikel an die Substanzen, Zellen oder auch Viren gekoppelt sind.

5

### Bezugszeichenliste

	1, 4, 18	Aussteuer-Magnetfeld
	2	Magnetisierungskennlinie, linear
	3	Magnetische Aussteuer-Induktion bei li-
5		nearer Magnetisierungskennlinie
	5	Magnetisierungskennlinie, nicht-linear
	6	Magnetische Aussteuer-Induktion bei
		nicht-linearer Magnetisierungskennlinie
	7	zusätzliche Abtast-Induktion bei linea-
10		rer Magnetisierungskennlinie
	8	Amplitude der magnetischen Induktion
		bei der Frequenz des Abtast-Magnet-
		feldes bei linearer Magnetisierungs-
		kennlinie
15	9, 10	zusätzliche Abtast-Induktion bei nicht-
		linearer Magnetisierungskennlinie bei
		Nulldurchgängen (9) und Extrema (10)
	11	Amplitude der magnetischen Induktion
		bei der Frequenz des Abtast-Magnet-
20		feldes bei nicht-linearer Magnetisie-
		rungskennlinie
	13, 16, 25	Oszillator
	14, 17	Feldgenerator
	15	Abtast-Magnetfeld
25	19	Antwort-Magnetfeld
	20	Magnetfeldsensor
	21, 23	phasenempfindlicher Detektor
	24	Ausgangsspannung
	26, 27, 28,	Frequenz-Teiler
30	29, 30	

20

#### Patentansprüche

- 1. Verfahren zum selektiven Nachweis und/oder zur
  Quantifizierung superparamagnetischer und/oder ferromagnetischer Partikel,
  dadurch gekennzeichnet, dass
  eine aufgrund der Nichtlinearität der Magnetisierungskennlinie der Partikel erzeugte FrequenzKomponente von Magnetfeldern bei einer Mischfrequenz gemessen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1,
   dadurch gekennzeichnet, dass
   die Partikel zur Aussteuerung ihrer Magnetisierungskennlinie (5) mit einem Aussteuer-Magnetfeld
   (4, 18) gegebener Frequenz beaufschlagt werden.
- 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Aussteuer-Magnetfeld (4, 18) eine Frequenz zwischen 50 und 100 Hertz aufweist.
  - 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Partikel mit einem Abtast-Magnetfeld (15) mit einer zum Aussteuer-Magnetfeld (4, 18) verschiedenen Frequenz beaufschlagt werden.
    - 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Abtast-Magnetfeld (15) eine Frequenz zwischen 10 und 100 Kilohertz aufweist.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

25

ein auf Grund der Einwirkung der beiden Wechsel-Magnetfelder (15, 18) induziertes Antwort-Magnetfeld (19) der Partikel gemessen wird.

- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Amplitudenvariation (8, 11) des Antwort-Magnetfeldes (19) bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes (15) gemessen wird.
- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

  bei dem die Frequenzkomponente der Amplitudenvariation (8, 11) des Antwort-Magnetfeldes (19) bei der
  Frequenz des Abtast-Magnetfeldes (15) gemessen
  wird, die ein ganzzahliges Vielfaches der Frequenz
  des Aussteuer-Magnetfeldes (4, 18) beträgt.
- 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Frequenzkomponente der Amplitudenvariation (8, 11) des Antwort-Magnetfeldes (19) bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes (15) gemessen wird, die ein geradzahliges Vielfaches der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes (4, 18) beträgt.
  - 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Frequenzkomponente der Amplitudenvariation (8, 11) des Antwort-Magnetfeldes (19) bei der Frequenz des Abtast-Magnetfeldes (15) gemessen wird, die das Doppelte der Frequenz des Aussteuer-Magnetfeldes (4, 18) beträgt.
  - 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Amplidudenvariation (11) des Antwort-

Magnetfeldes (19) gewandelt und als Ausgangsspannung (24) zur Bestimmung der Konzentration des Analyten verwendet wird.

12. Vorrichtung zum selektiven Nachweis und/oder zur Quantifizierung superparamagnetischer und/oder ferromagnetischer Partikel an Analyten umfassend:

5

10

15

- einen Behälter (12) mit nachzuweisendem und/oder zu quantifizierenden Analyten,
- mindestens einen Oszillator (13, 16; 25), zur Erzeugung von Frequenzen von Wechsel-Magnetfeldern (15, 18),
- mindestens einen Feldgenerator (14, 17) zur Beaufschlagung des Analyten mit Wechselmagnetfeldern (15, 18),
- einen Magnetfeldsensor (20), zur Messung eines Antwort-Magnetfeldes (19) der Partikel, sowie
  - mindestens einen phasenempfindlichen Detektor (21, 23).
- 13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
  20 umfassend
  mindestens einen Frequenz-Teiler (26, 27, 28, 29,
  30) zur Teilung der Frequenz des Oszillators (25).
- 14. Vorrichtung nach Anspruch 13,
  dadurch gekennzeichnet, daß

  der oder die Frequenz-Teiler (26, 27, 28, 29, 30)
  die Oszillator-Frequenz im Verhältnis ganzer, positiver Zahlen teilen.
  - 15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass

die Frequenz-Teiler (26, 27, 28) die Oszillator-Frequenz in den Verhältnissen

$$\frac{1}{\ell}$$
,  $\frac{1}{m \cdot n}$  und  $\frac{1}{n}$  teilen.

5 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz-Teiler (28, 29, 30) die Oszillator-Frequenz in den Verhältnissen

$$\frac{1}{n}$$
,  $\frac{1}{n+m}$  und  $\frac{1}{n(n+m)}$ 

10 teilen.

- 17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche15 oder 16,mit ganzen, positiven Zahlen für l, m und n.
- 18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche
  15 bis 17,
  mit m als gerader Zahl, insbesondere mit m = 2.
- 19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche
  13 bis 18,
  die mindestens eine in einem Frequenz-Teiler (26,
  28) heruntergeteilte Oszillator-Frequenz als Referenz in mindestens einen phasenempfindlichen Detektor (21, 23) einspeist.
  - 20. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche
    13 bis 19,
- die eine im Frequenz-Teiler (26) heruntergeteilte Oszillator-Frequenz als Referenz in einen phasen-

PCT/DE2004/000149

empfindlichen Detektor (21) und die eine im Frequenz-Teiler (28) heruntergeteilte Oszillator-Frequenz als Referenz in einen phasenempfindlichen Detektor (23) einspeist.

- 5 21. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 20, gekennzeichnet durch, Feldgeneratoren (14, 17), die durch die Frequenzen der Frequenz-Teiler (26, 27; 29, 30) angesteuert werden.
  - 22. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 21, umfassend mindestens einen Frequenzvervielfacher (22).
- 15 23. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Magnetfeldsensor (20) differentiell ausgebildet ist.
- 24. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche
  12 bis 23,
  dadurch gekennzeichnet, dass
  der Magnetfeldsensor (20) zwei Teilspulen gleicher
  Bauart umfasst.
- 25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass

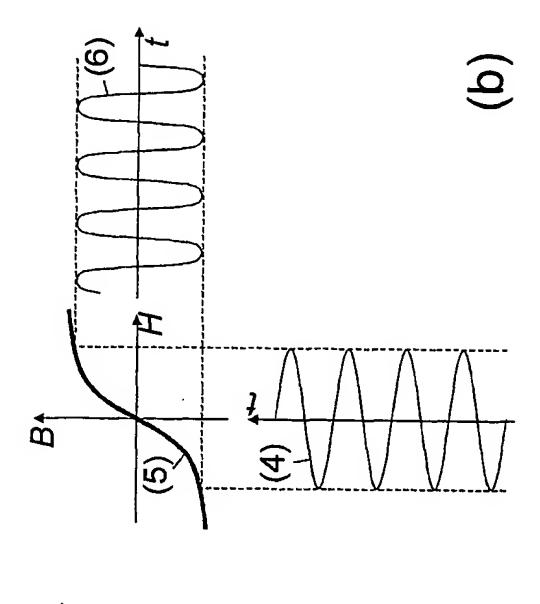
die Teilspulen des Magnetfeldsensors (20) gegensinnig gewickelt sind.

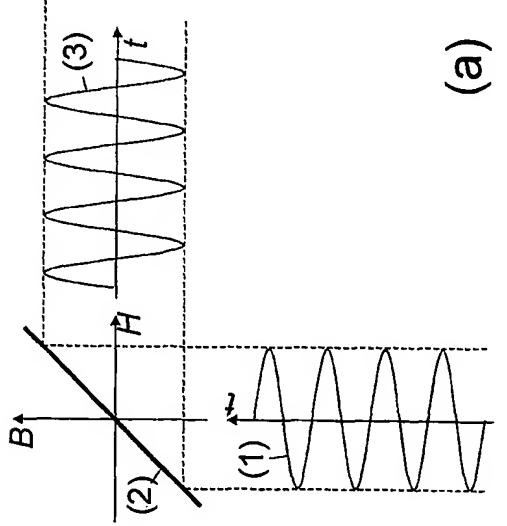
- 26. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 25,
- dadurch gekennzeichnet, dass die Teilspulen des Magnetfeldsensors (20) in Serie geschaltet sind.
  - 27. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche 12 bis 26,
- dadurch gekennzeichnet, dass

  der Behälter (12) mit den Analyten nur mit einem

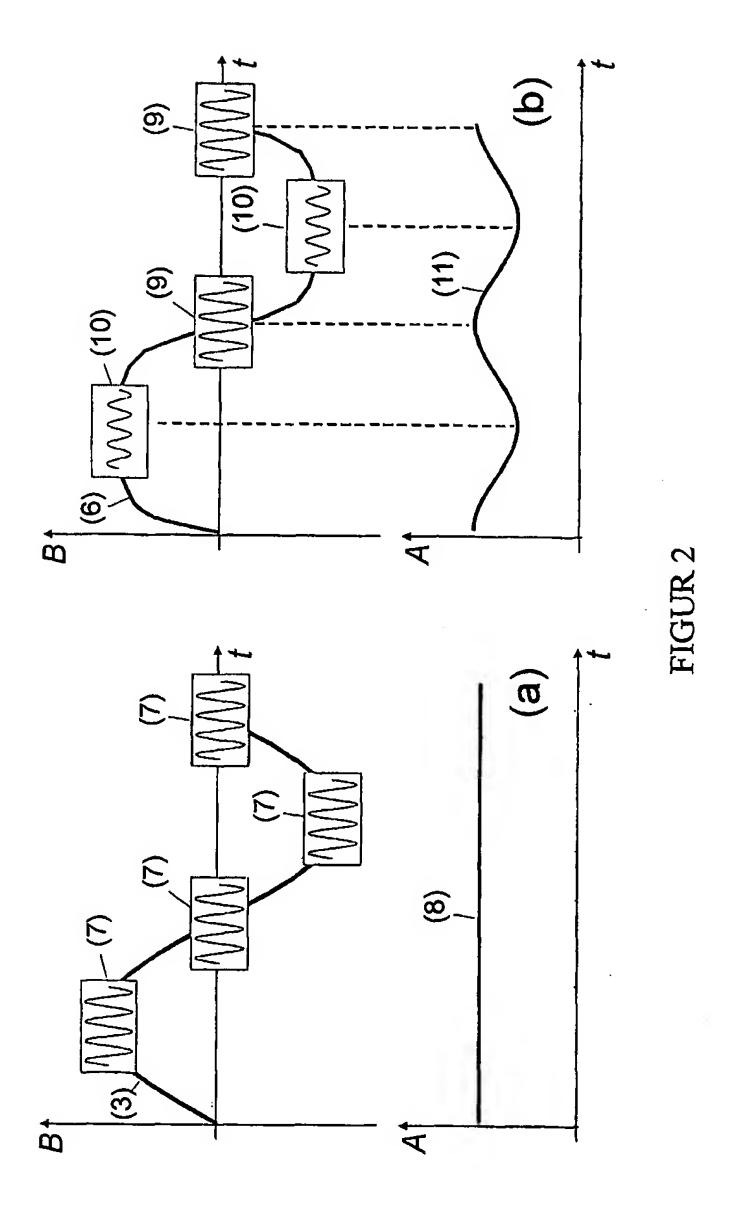
  der beiden Teilspulen des Magnetfeldsensors (20) in

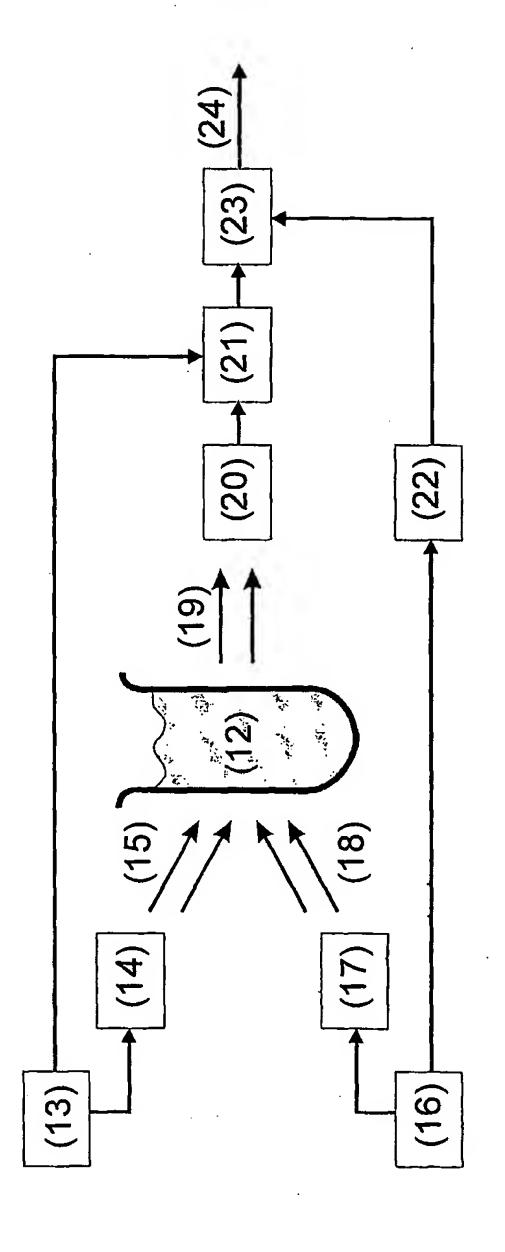
  Kontakt steht.



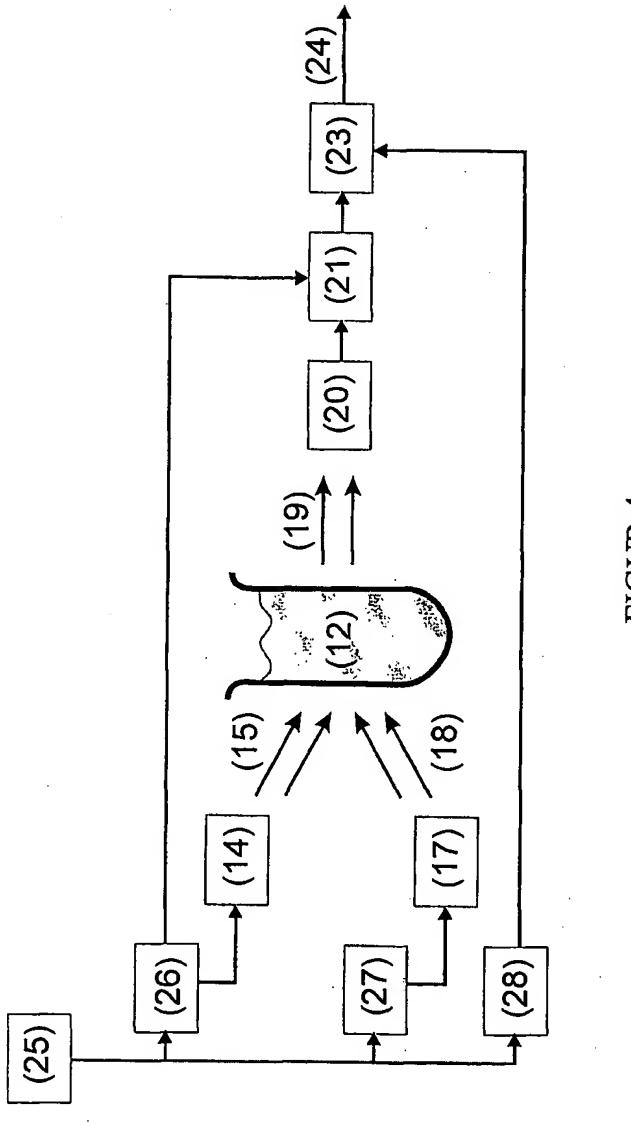


FIGUR 1

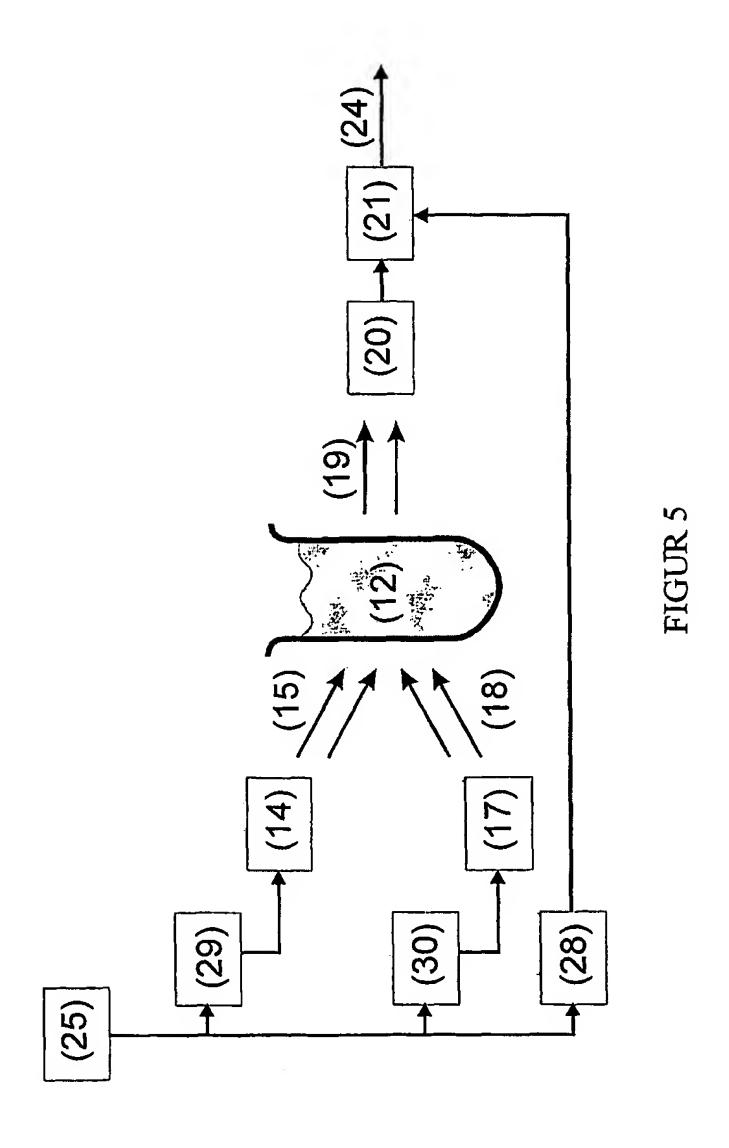


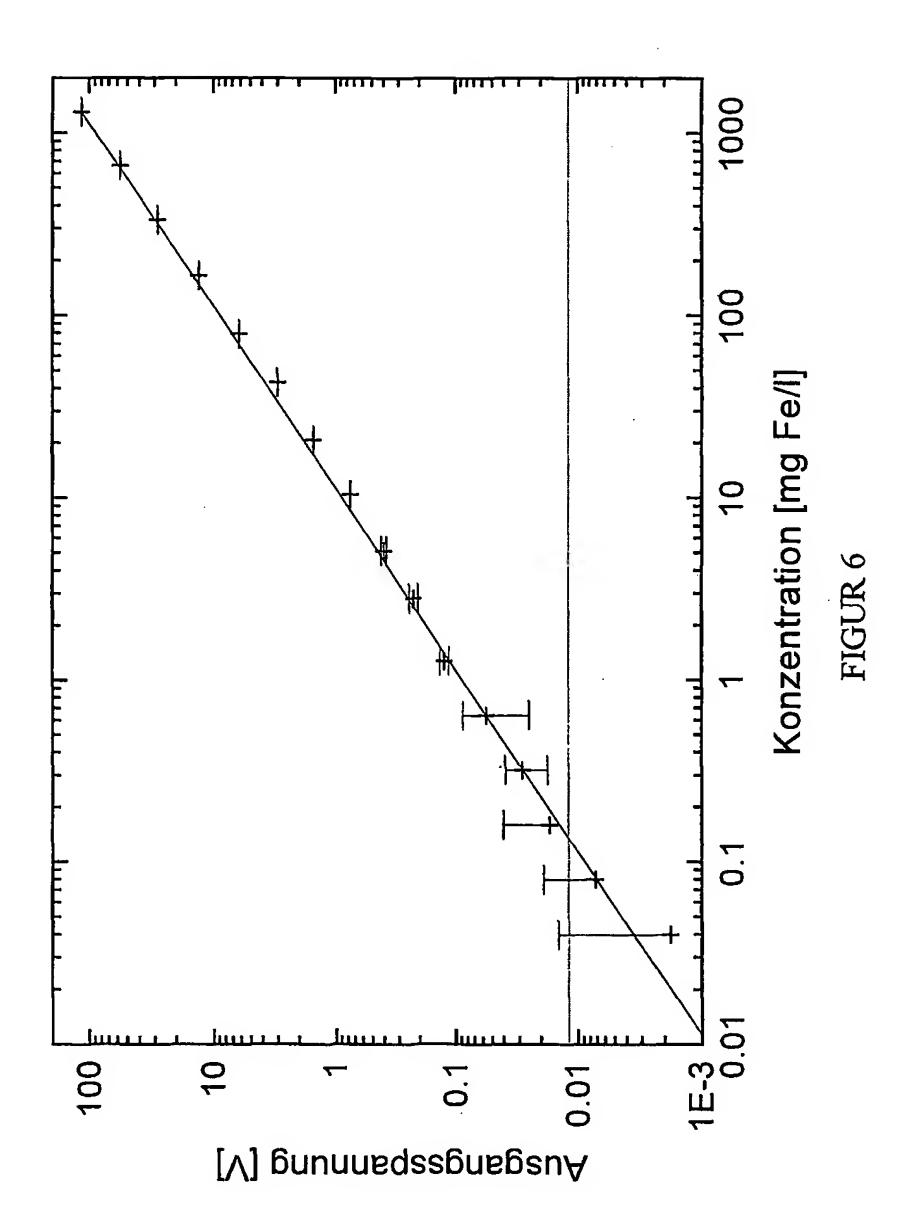


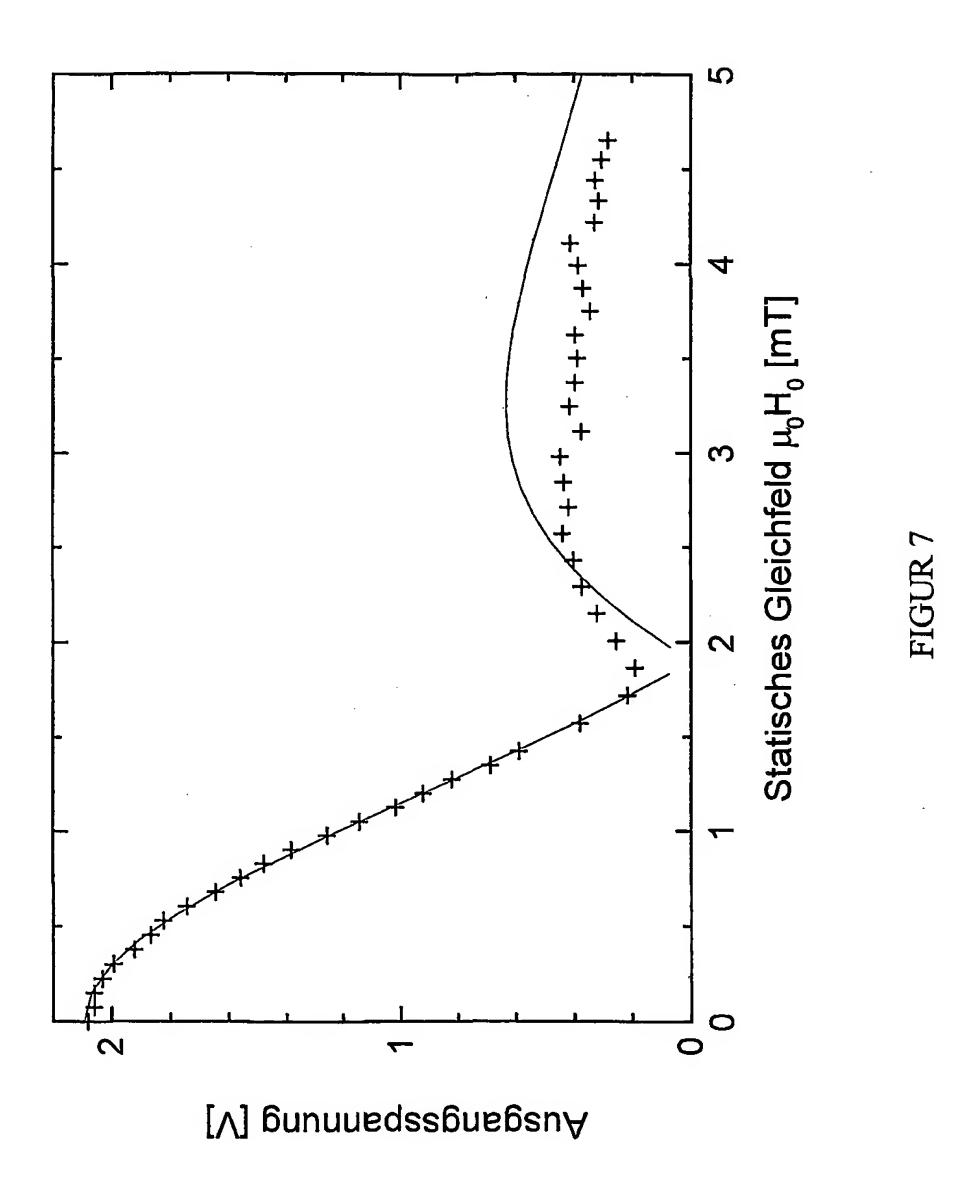
FIGUR 3

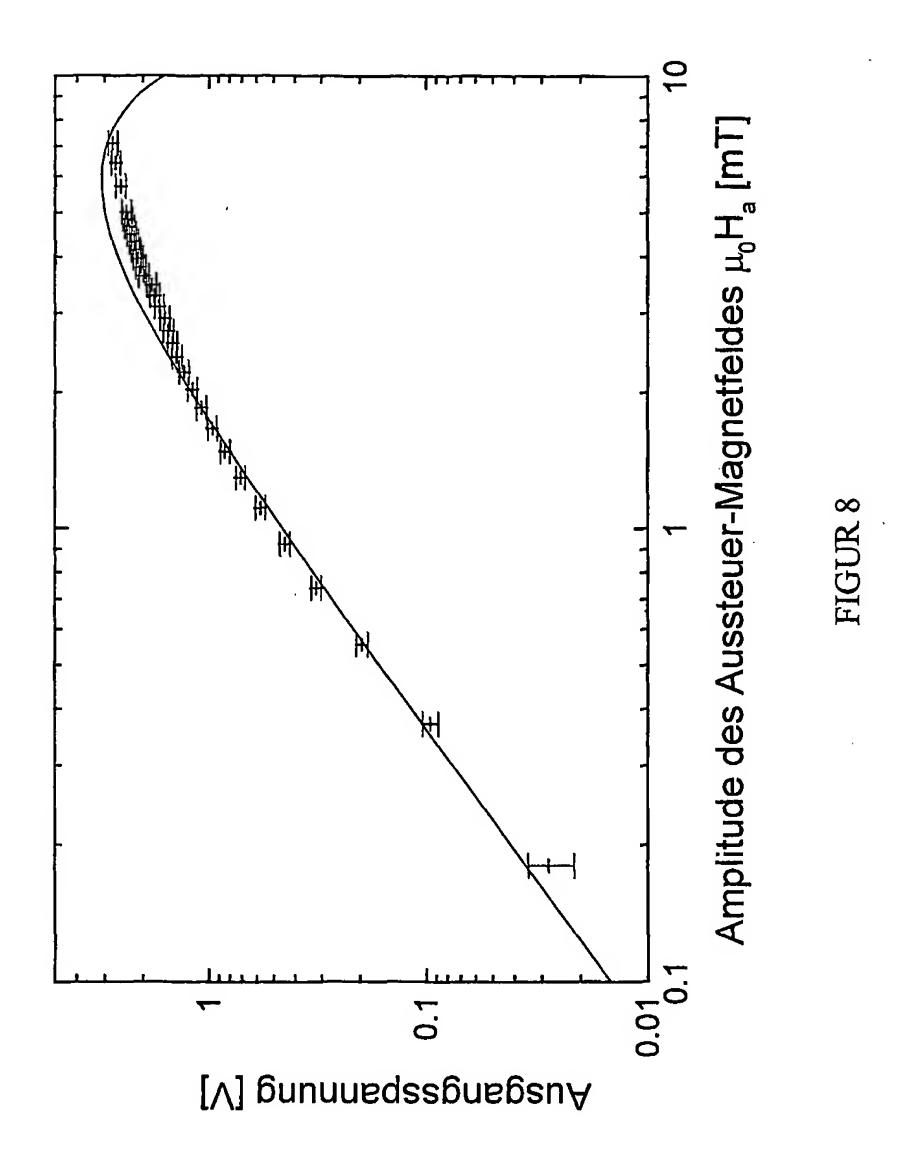


IGUR 4

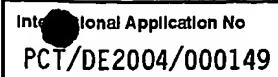








## INTERNATIONAL SEARCH REPORT



A. CLASS IPC 7	GO1N27/74 GO1N33/543		
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	dification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum de IPC 7	ocumentation searched (classification system followed by classific GO1N	cation symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent the	at such documents are included in the fields s	earched
Electronic d	lata base consulted during the International search (name of data	base and, where practical, search terms used	i)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ	•	
			·
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 005 001 A (CORDERY ROBERT	A)	1-11
Α	2 April 1991 (1991-04-02)		12_27
Λ	abstract; figures 1-5 column 2, line 56 -column 4, li	ne 28	13–27
X	US 6 046 585 A (SIMMONDS MICHAE 4 April 2000 (2000-04-04)	L BANCROFT)	12,23-27
γ	4 APT 1 2000 (2000-04-04)		12
•	abstract; figure 4 column 2, line 66 -column 7, li	ne 40	12
Y	WO 00/49407 A (HENNES KILIAN) 24 August 2000 (2000-08-24) abstract; figure 3 page 1-7		12-22
	<b></b>		
		-/	
·		•	
X Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	n annex.
° Special ca	tegories of cited documents:	*T* later document published after the inte	rnational filing date
consid	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance document but published on or after the international	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but eory underlying the
filing d	late	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot	l be considered to
which	int which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the o	
	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an indocument is combined with one or mo	ventive step when the
other r	neans	ments, such combination being obvious in the art.	
later th	ent published prior to the International filing date but nan the priority date claimed	"&" document member of the same patent	family
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report
1	4 June 2004	23/06/2004	
Name and n	nailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Klein, M-O	
	Fax: (+31-70) 340-3016	1 110111, 11 0	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int	tional Application No
PC	DE2004/000149

<u> </u>	Man Door Hereto Consideration	PCT/DE2004	1/000149
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	DE 101 26 940 A (CONRADT ROBERT) 5 December 2002 (2002-12-05) the whole document		12
Y	GB 1 603 578 A (UNIV GEORGETOWN) 25 November 1981 (1981-11-25) page 1-9; figures 1,4,7,14		13-21
Υ	US 6 201 391 B1 (KWUN HEGEON ET AL) 13 March 2001 (2001-03-13) column 6, line 5-56; figure 2 column 3, line 62 -column 4, line 5		13-22
A	US 5 001 424 A (ERICKSON JOHN R ET AL) 19 March 1991 (1991-03-19) the whole document		1-27
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 141 (P-283), 30 June 1984 (1984-06-30) & JP 59 040287 A (ANRITSU DENKI KK), 5 March 1984 (1984-03-05) abstract		13-21
į		·	
		10	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Internal Application No PCT/DE2004/000149

Patent document cited in search report			Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US	5005001	A	02-04-1991	CA	2039760	A1	06-10-1991
US	6046585	A	04-04-2000	 AU	9207998	<del></del> - А	15-06 <b>-</b> 1999
				BR	9815566	Α	31-10-2000
				CA	2311301	A1	03-06-1999
				CN	1128365	В	19-11-2003
				EP	1036328	A1	20-09-2000
				IL	136211	A	10-04-2003
				JP	2001524675	T	04-12-2001
				MO	9927369		03-06-1999
				US	6437563		20-08-2002
				US	6275031	B1	14-08-2001
				US		A1	20-12-2001
				US	2001052770	A1 	20-12-2001
WO	0049407	Α	24-08-2000	DE	19906352	A1	22-07-1999
				DE	19939208		07-09-2000
				AU	4102000		04-09-2000
				CA	2370745	· <del>-</del>	24-08-2000
				DE	19946656	_	24-08-2000
				MO	0049407		24-08-2000
				EP	1198712	A2 	24-04-2002
DE	10126940	A	05-12-2002	DE	10126940	A1	05-12-2002
GB	1603578	Α	25-11-1981	DE	2837265	A1	06-03-1980
				CA	1157096		15-11-1983
				CH	660799		15-06-1987
				FR	2456951	= .	12-12-1980
				NL	7903965		25-11-1980
				SE	440832		19-08-1985
				SE 	7904329	A 	18-11-1980 
US	6201391	B1	13-03-2001	NONE			
US	5001424	Α	19-03-1991	NONE		. — <b>— —</b>	
JP	59040287	A	05-03-1984	NONE			

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

lonales Aktenzeichen

PCT/DE2004/000149 A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01N27/74 G01N33/543 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 GO1N Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie® Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. US 5 005 001 A (CORDERY ROBERT A) 1-11 2. April 1991 (1991-04-02) Α 13-27 Zusammenfassung; Abbildungen 1-5 Spalte 2, Zeile 56 -Spalte 4, Zeile 28 X US 6 046 585 A (SIMMONDS MICHAEL BANCROFT) 12,23-27 4. April 2000 (2000-04-04) 12 Zusammenfassung; Abbildung 4 Spalte 2, Zeile 66 -Spalte 7, Zeile 40 WO 00/49407 A (HENNES KILIAN) 12-22 24. August 2000 (2000-08-24) Zusammenfassung; Abbildung 3 Seite 1-7 Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
 ; \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht koilldiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist \*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkell beruhend betrachtet werden anderen im Recherchen bericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamille ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden Ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts 23/06/2004 14. Juni 2004 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Palentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Klein, M-O

Fex: (+31-70) 340-3016

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interionales Aktenzelchen
PCT/DE2004/000149

	101701	2004/000149
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 101 26 940 A (CONRADT ROBERT)  5. Dezember 2002 (2002-12-05) das ganze Dokument	12
Y	GB 1 603 578 A (UNIV GEORGETOWN) 25. November 1981 (1981-11-25) Selte 1-9; Abbildungen 1,4,7,14	13-21
<b>Y</b>	US 6 201 391 B1 (KWUN HEGEON ET AL) 13. März 2001 (2001-03-13) Spalte 6, Zeile 5-56; Abbildung 2 Spalte 3, Zeile 62 -Spalte 4, Zeile 5	13-22
<b>A</b>	US 5 001 424 A (ERICKSON JOHN R ET AL) 19. März 1991 (1991-03-19) das ganze Dokument	1-27
<b>A</b>	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 141 (P-283), 30. Juni 1984 (1984-06-30) & JP 59 040287 A (ANRITSU DENKI KK), 5. März 1984 (1984-03-05) Zusammenfassung	13-21
; !		
		·

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interponales Aldenzeichen	•
PCT/DE2004/00014	49

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
US	5005001	Α	02-04-1991	CA	2039760	A1	06-10-1991
US	6046585	 А	04-04-2000	AU	9207998	Δ	15-06-1999
		, ,		BR	9815566		31-10-2000
				CA	2311301		03-06-1999
				CN	1128365		19-11-2003
				ΕP	1036328		20-09-2000
				IL	136211	Α	10-04-2003
				JP	2001524675	T	04-12-2001
				WO	9927369	A1	03-06-1999
				US	6437563	B1	20-08-2002
				US	6275031	B1	14-08-2001
				US	2001052769		20-12-2001
		~ <b></b> -		US	2001052770	A1	20-12-2001
WO	0049407	Α	24-08-2000	DE	19906352	A1	22-07-1999
				DE	19939208	A1	07-09-2000
				AU	4102000		04-09-2000
				CA	2370745		24-08-2000
				DE	19946656	• • —	24-08-2000
			•	MO	0049407		24-08-2000
			ر ہے، سے سے سے سے سے می سے سے سے سے	EP 	1198712	A2 	24-04-2002
DE	10126940	A	05-12-2002	DE	10126940	A1 -	05-12-2002
GB	1603578	Α	25-11-1981	DE	2837265	A1	06-03-1980
				CA	1157096		15-11-1983
				CH	660799		15-06-1987
				FR	2456951	–	12-12-1980
				NL	7903965		25-11-1980
				SE	440832		19-08-1985
				SE 	7904329	A 	18-11-1980
US	6201391	B1	13-03-2001	KEINE			
US	5001424	Α	19-03-1991	KEINE			
JP	59040287		05-03-1984	KEINE			